**ESM\_2 – изменение интенсивности и площади линий стекла от глубины фокусировки лазера**

На графике приведены зависимости изменения площадей, интенсивностей и их соотношений от глубины фокусировки лазера для спектра эталонного стекла GL-4 из набора SGS. На (Рис. а, б) показано изменение отношения площадей (*Aw/As*) и интенсивностей (*I3550/I480*) при изменении глубины фокусировки. На (Рис в, е) показано изменение интенсивности водного пика и силикатного пика, соответственно. На (Рис. г, д) показано изменение суммарной площади силикатных пиков в диапазоне 850-1200 см-1 и водных пиков в диапазоне (2900-3800

см-1), соответственно. На (Рис. ж) приведено отношение суммарной площади водной части спектра в диапазоне 2900-

3800 см-1 к суммарной площади всей силикатной части спектра в диапазоне 100-1200 см-1.

Базовая линия вычиталась, следуя процедуре, описанной в разделе «*Определение содержания воды в силикатных стеклах методом КР-спектроскопии*».

Параметры анализа: длина волны лазера 532 нм, мощность 75 мВт, размер конфокального отверстия 100 мкм, спектральное разрешение дифракционной решетки 1800 штр/мм. 10 циклов накопления в пределах спектрального окна, 10 сек – время накопления, суммарное время накопления сигнала в одном спектральном окне 100 сек. Для сбора рассеянного света использовался объектив 100× с числовой апертурой 0.9. Анализ проведен при глубине фокусировки 0 (поверхность РВ), 2, 4, 8, 12, 14, 16 мкм.

